点接触型トンネルスペクトロスコピーによる narrow-gap半導体Pb(Tl)Te電子状態の測定研究

溝 俣 洋 一

 $\mathbb{N}-\mathbb{N}$ 族 narrow-gap 半導体に \mathbb{M} 族の \mathbb{N} たの \mathbb{N} たの \mathbb{N} に marrow-gap 半導体に \mathbb{N} 族の \mathbb{N} が marrow-gap 半導体に \mathbb{N} 族の \mathbb{N} が marrow-gap 半導体に \mathbb{N} 族の \mathbb{N} が marrow-gap 半導体に \mathbb{N} が marrow-gap に \mathbb{N}

本研究では Pb(Tl) Te の電子状態の,Tl ドーピングによるキャリアー 濃度変化に対する依存性を,In と Pb(Tl) Te の接合による 点接触型トンネルスペクトロスコピーを用いて測定し,Pb(Tl) Te の超伝導と Tl 不純物バンドとの関係を電子状態密度の側面から調べることを試みた。

13. KDPの高圧下ラマン散乱による研究

有 馬 诵 継

KH2PO4の低周波B2ラマンスペクトルの静水圧下での観測を室温のもとで、1 bar ~5 2 kbar の圧力範囲にわたって行った。得られたスペクトルに対して Peercy と同じ方法で解析を行い結果を90度散乱の場合と前方散乱の場合について比較したところKDPのソフトモードは通常の強誘電性ソフトモードの分散関係を示さないことが明らかになった。

さらに今回初めて40kbar 付近に圧力と共に成長するセントラルモードを発見した。このモードに緩和型を仮定して解析を行ったがその結果は40kbar 付近での圧力誘起相転移の存在を示唆する。